NFCフォーラム、EMVCo、ISO14443、UICC/CLF/SWP等スマートカードテスト無料セミナー

GoogleがNFCを採用するなどNFCの技術を搭載したスマートフォンの需要が急速に高まっております。

このトレンドをいち早く察知した弊社ではNFC搭載スマートフォンの接触、非接触部分の両方を通信解析できるテストツールに特に力を入れてきました。

そこで、NFCの技術を支えておられる皆様方が開発、メンテナンス業務をされる際により速く、正確にテストを実施可能なツールをこのたび用意させていただきました。

この度、これらのツールを皆様の開発及びメンテナンスでお役に立てて頂きたく、弊社のテストツールに関するセミナーを企画しました。

当セミナーではこれらのテストツールでご紹介させて頂くと共に実際にデモンストレーションを実施いたしますので製品の機能を実際にご覧頂けます。

○● セミナー内容情報 ●○

１、Keolabsが出すテストツールのプレゼンテーション
・ スマートカードISO17025認証テストハウス「Soliatis LAB」がだすテストツール概要
・ 接触型及び非接触型のスマートカードのプロトコルアナライザツールの紹介
・ NFCFORUM, ISO10373-6, ISO10373-7, EMVCo等で必要な器具の紹介
・ ISO14443, Felica, ISO15693, NFCIP1, NFCIP2, NFC Forum, ICAO, SWP, 7816....
に関連するコンプライアンステストの紹介

２、NFCフォ-ンテストツールのデモンストレーション
接触部分(UICC、CLF)通信解析、コンプライアンステスト

３、NFCフォーンテストツールのデモンストレーション
非接触型部分(NFC Forum)通信解析、コンプライアンステスト

４、質疑応答

◆ 会期 ２０１２年６月７日（木）

受付１３時～

開場１３時１５分～

閉場１６時３０分

◆ 会場 T’ｓ渋谷フラッグ

〒150-0042東京都渋谷区宇田川町33-6Shibuya Flag（渋谷駅から徒歩５分程）

セミナーへご出席をご希望の方は必要項目をご記入の上、下記アドレス宛てにご連絡ください。

◆ ご連絡項目

・ 会社名

・ 部署

・ お名前

・ 電話番号

・ ご興味のあるテスト

◆ 申し込み先：keolabs@positive-one.com

尚、お申し込みは会場設置の関係上５月３１日頃までにお願いいたします。

++++++